



## Model Xlaminer

- Hệ thống kiểm tra X-ray tự động với độ phân giải cấp Micro sử dụng kiểm tra chi tiết cơ khí nhỏ và bo mạch trong công nghiệp bán dẫn và SMT...
- Độ phân giải 3  $\mu\text{m}$
- Ống phát tia X Microfocus 100kV/10W (Tùy chọn 130kV/39W)
- Độ phân giải hình ảnh kỹ thuật số đạt 2 megapixels
- Độ phóng đại (2D): 75 lần
- Góc quan sát có thể điều chỉnh: nghiêng  $\pm 45^\circ$ , quay n x  $360^\circ$  (tùy chọn)
- Kích thước kiểm tra mẫu tối đa 710 mm x 560 mm; Điều khiển trên 3 trục
- Khối lượng mẫu kiểm tra tối đa : 5 kg
- Hệ thống nhỏ gọn dạng cabin phù hợp cho mọi phòng thí nghiệm hoặc dây chuyền sản xuất



## Model Nanomex

- Hệ thống kiểm tra X-ray tự động với độ phân giải cấp Nano sử dụng kiểm tra chi tiết cơ khí nhỏ và bo mạch trong công nghiệp bán dẫn và SMT...
- Độ phân giải đạt tới 200 nm
- Ống phát tia X công suất lớn Nanofocus 180kV/15W
- Độ phân giải hình ảnh kỹ thuật số đạt 2 megapixels (Tùy chọn 4 megapixels)
- Độ phóng đại (2D): 1970 lần; Độ phóng đại (3D): <300 lần,
- Góc quan sát có thể điều chỉnh:  $0 \rightarrow 70^\circ$  độ
- Kích thước kiểm tra mẫu tối đa 680 mm x 635 mm; Điều khiển trên 5 trục
- Khối lượng mẫu kiểm tra tối đa : 10 kg
- TÙY CHỌN chức năng nanoCT với khả năng quét CT chỉ trong 10s
- Hệ thống nhỏ gọn dạng cabin phù hợp cho mọi phòng thí nghiệm hoặc dây chuyền sản xuất



## Model Micromex

- Hệ thống kiểm tra X-ray tự động với độ phân giải cấp Micro sử dụng kiểm tra chi tiết cơ khí nhỏ và bo mạch trong công nghiệp bán dẫn và SMT...
- Độ phân giải 0.5  $\mu\text{m}$
- Ống phát tia X công suất lớn Microfocus 180kV/20W
- Độ phân giải hình ảnh kỹ thuật số đạt 2 megapixels
- Độ phóng đại (2D): 1970 lần, độ phóng đại (3D): 100 lần
- Góc quan sát có thể điều chỉnh:  $0 \rightarrow 70^\circ$  độ
- Kích thước kiểm tra mẫu tối đa (H x D): 680 mm x 635 mm; Điều khiển trên 5 trục
- Khối lượng mẫu kiểm tra tối đa: 10 kg
- TÙY CHỌN chức năng 3D CT với khả năng quét CT chỉ trong 10s
- Hệ thống nhỏ gọn dạng cabin phù hợp cho mọi phòng thí nghiệm hoặc dây chuyền sản xuất



## Model nanotom s (/nanotom m)

- Hệ thống kiểm tra Xray công nghệ CT phù hợp cho các ứng dụng nghiên cứu vật liệu, mẫu quặng, kiểm tra khuôn mẫu, chi tiết điện tử - bán dẫn, chi tiết cơ khí kim loại, lắp ráp phức tạp...
- Kết hợp chụp ảnh X-ray kỹ thuật số 2D và công nghệ chụp ảnh cắt lớp CT
- Ống phát tia X-ray lưỡng cực 180kV/15W
- Độ phóng đại 2D: 1.5  $\rightarrow$  100 lần
- Kích thước nhỏ có thể phát hiện: 200nm; Độ phân giải 3D: < 500 nm
- Kích thước mẫu kiểm tra tối đa (H x D): 150 mm x 120 mm (/250mm x 240mm); Điều khiển trên 5 trục
- Khối lượng mẫu kiểm tra tối đa: 2 kg (/3 kg)
- Chức năng tái tạo hình ảnh có kích thước và so sánh với bản vẽ CAD (Tùy chọn)